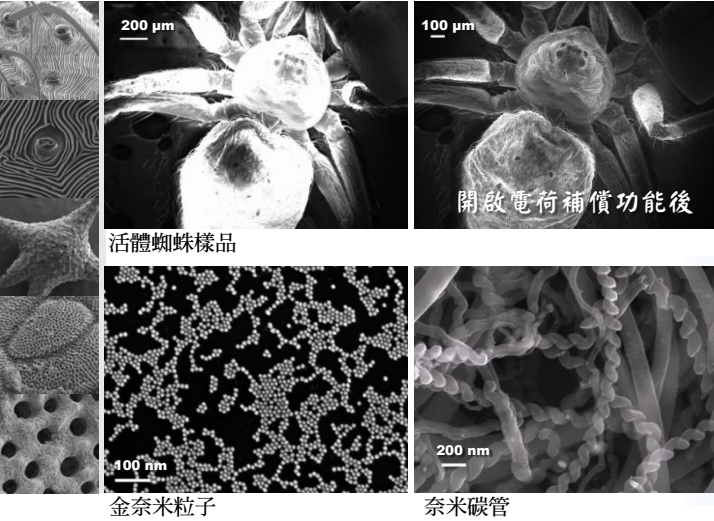


# 場發射掃描式電子顯微鏡

## Carl Zeiss FE-SEM ULTRAplus

# 非導體

### • ULTRA Application Examples



活體蜘蛛樣品

開啟電荷補償功能後

金奈米粒子

奈米碳管

### Charge Compensation

具有電荷累積消除補償器(Charge Compensator)，可在高加速電壓模式下拍攝非導體樣品不需額外濺鍍金膜，亦能以低加速電壓(最低為0.1 KV)條件直接拍攝非導體樣品。

### Precise and clear imaging

具備高電流高景深模式，以及多重偵測器(InLens、SE2、EsB、AsB)可同時偵測SE與BSE之訊號，並可混合(Mixing)兩種訊號輸出成像。配有能量散射分佈儀(EDS)可作元素之定性定量分析。

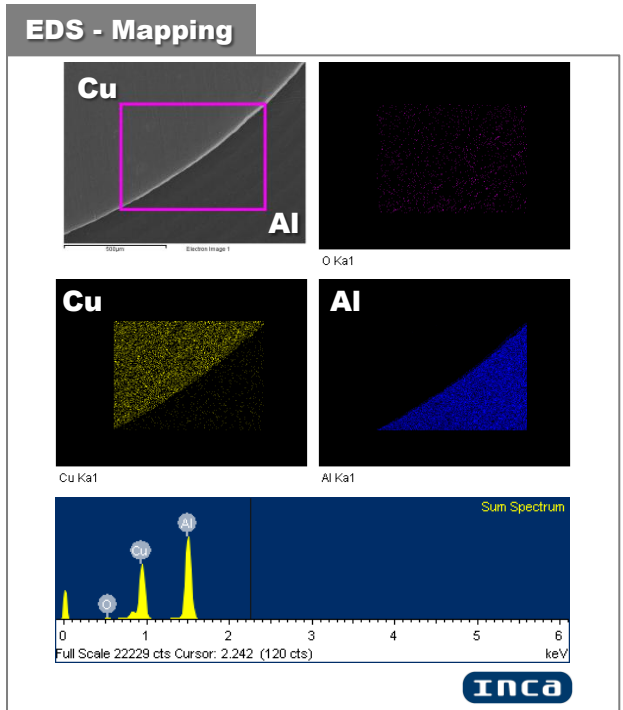
### 服務對象

Semiconductor    Material Analysis    Life Science

複合材料  
高分子材料  
陶瓷材料  
玻璃樣品  
紡織品

奈米材料  
Au/Ag/CNT/QDs ...  
磁性材料  
薄膜形貌鑑定  
生物材料  
動植物樣品

8" Silicon wafer  
Solar cell  
DSSC  
LED Chip  
觸控面板  
各式粉體樣品



| 項目說明   | 計費方式說明       |           |  |
|--------|--------------|-----------|--|
|        | 營利事業單位(委託操作) | 學術研究單位    | 備註                                       |
| FE-SEM | 1500 元/ 樣品   | 600 元/ 樣品 | 一案件以取四點給四個檔案為原則，超過一小時則以小時計算之，業界以半小時為單位計算 |
| EDS    | 500 元/ 次     | 200 元/ 次  |  |

- 一次購買100小時以上則改以小時計費且不限定樣品數量，得考取操作執照之資格。其他優惠方式請洽詢服務人員。
- 自收件日起五個工作天內可完成拍攝及取件
- 預約請使用國立中興大學校內貴儀預約系統  
網址：[http://nchu.creatop.com.tw/chinese/04\\_achievement/0411\\_list.aspx](http://nchu.creatop.com.tw/chinese/04_achievement/0411_list.aspx)  
請點選-場發射掃描式電子顯微鏡(UltraPlus)

諮詢老師：國立中興大學化學系 林寬銘 教授

操作人員聯絡方式

Tel&Fax : 04-22854068

E-mail : 張勝岳 sychang@dragon.nchu.edu.tw

詹騏銘 arcart0719@gmail.com

